連続講座

断層映像法の基礎 第9回 MRI 投影再構成法のシミュレーション

篠原	広行1)
橋本	雄幸2)
杉本	英冶3)

1)東京都立保健科学大学 放射線学科
2)横浜創英短期大学 情報処理学科
3)昭和大学藤が丘病院 放射線科

はじめに

第8回までに、MRIの基礎をその理論を中心に説明 してきた。どのような原理で計測され、その測定デー タからフーリエ変換を利用してどのように画像を再構 成するかなど、画像を作る上での基本となる部分を、 数式などの上で見てきたことになる。本稿では、その 計測と画像再構成の部分を計算機上でシミュレートす ることで、さらに詳しく説明する。計算機上で数値ファ ントムを作成して、そのファントムからどのような信号 が計測され、それを元にどのように画像が再構成され るのかを計算機シミュレーションで示す。

今回は、MRIの画像再構成の基本である投影再構 成法でのシミュレーションを示す。まずは、マトリック スの1点にのみ水素原子がある場合の計測データを示 す。次に、そのデータから、元の1点が再構成され、そ の位置を特定できることを示す。ここで用いる再構成 法は、フィルタ補正逆投影(filtered back-projection :FBP)である。次に、数値ファントムを用いたシミュ レーションを示すが、まずは、数値ファントムがどのよ うなものであるかを説明し、投影再構成法での計測デ ータを示す。最後にその画像再構成を行い、再構成 された画像を示す。

1.	1点画像の計測
2.	1点画像の再構成
3.	数値ファントムからの計測
4.	数値ファントムの画像再構成

1.1点画像の計測

1方向に勾配磁場Gを加えると、その方向における 水素原子核の共鳴周波数は、その方向で線形的に変 化する。勾配磁場を加える方向をXとすると共鳴周波 数ωはXの関数となり、式で表すと、

$$\omega(\mathbf{X}) = \gamma \left(\mathbf{B}_0 + \mathbf{G}\mathbf{X}\right) \tag{1}$$

となる。ここで、yは磁気回転比で、B0は静磁場の強 度である。水素原子がある1点X0にのみ存在する場 合、そこから出てくる信号s(t)は、

$s(t)=S_0e^{-i\gamma(B_0+GX_0)t}$

となる。ここで、S₀はX₀に存在する水素原子の量に相 当する強度である。実際の計測は、実部の値と虚部 の値に分けて計測するわけだが、その場合、計測の ためのコイルを90度ずらした位置に置いて計測する。 実部の計測値は、

$s_{re}(t)=S_0cos[\gamma(B_0+GX_0)t]$

となり、虚部の計測値は、

$s_{im}(t) = -S_0 sin[\gamma (B_0 + GX_0)t]$ (4)

となる。

この計測値に実際の値を当てはめて、シミュレーシ ョンする。磁気回転比 y は水素原子核の場合、 42.58MHz/T (テスラ)である。静磁場強度B₀を1T (テ スラ)と仮定し、勾配磁場Gを0.1G (ガウス) / cmとす る。1G (ガウス)は、10⁴T (テスラ)である。水素原子 の信号強度S₀は1とし、X₀を中心から5cm離れた場所 に設定する。すると、実部の計測値は、

 $s_{re}(t) = \cos[2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times (1+0.1 \times 10^{-4} \times 5) \times t]$ (5)

となる。一方、虚部の計測値は、

 $s_{im}(t) = -\sin[2 \times \pi \times 42.58 \times 10^6 \times (1+0.1 \times 10^{-4} \times 5) \times t] \quad (6)$

別刷請求先:〒116-8551 東京都荒川区東尾久7-2-10 東京都立保健科学大学 保健科学部放射線学科 篠原広行 Tel:03-3819-1211 Fax:03-3819-1406 (3)

(2)

180-(42)

となる。これらの計測値は、静磁場強度の値が乗った 形になっているので、ここから静磁場強度の影響を取 り除いてやる。その方法は、

 $s(t)=e^{-i\gamma B_0 t}\times e^{-i\gamma G X_0 t}$

と2つの積に分けて考え、静磁場強度の影響を取り除 いた値s'(t)を、

(7)

 $s'(t)=s(t)\times e^{i\gamma B_0 t}=e^{-i\gamma G X_0 t}$ (8)

と計算することができる。すると、計測値の実部と虚 部は、

 $s'_{re}(t) = cos(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times 5 \times t)$ (9a)

 $s'_{im}(t) = -\sin(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times 5 \times t)$ (9b)

となる。計測を0.1msごとに行うとすると、

 $s'_{re}(k) = \cos(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times 5 \times k \times 10^{-4})$ (10a)

 $s'_{im}(t) = -\sin(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times 5 \times k \times 10^{-4})$ (10b)

となる。ここで、kは0から計測数nまでの整数値をと る。この式をグラフにして表したものを図1に示す。ま た、勾配磁場Gを0.2G/cm、0.05G/cm、0.02G/cmに 変えたグラフをそれぞれ図2(a)から(c)に示す。勾配磁 場を小さくするほど、正弦曲線がなめらかになってい ることが分かる。

2.1点画像の再構成

画像の大きさを縦横共に20cmとし、画像の中心から右(x軸の正の方向)へ5cmのところに1点だけ水素 原子が存在するものとする。画像のマトリックスを 128×128画素としたときの1点の画像を図3に示す。投 影再構成法では、勾配磁場の方向を変えながら各方



図1 計測の勾配磁場Gを0.1G/cmとしたときの計測デ ータのグラフ。水素原子の信号強度Soは1とし、水素 原子が存在する1点の位置を中心から5cm離れた場所 に設定し、サンプリング間隔を0.1msで計測したと仮 定している。





(b) 勾配磁場が0.05G/cmの場合



(c) 勾配磁場が0.02G/cmの場合

図2 勾配磁場Gを変えた場合の 計測データのグラフ。



図3 画像上で、水素原子が存在する点を示している。 画像の大きさは20cm正方で、水素原子の位置は、画像 の中心から右方向に5cmずれたところにある。

向の投影のフーリエ変換に相当するデータを計測して いく。よって、計測データはθの関数となる。計測デー タ上の水素原子の位置X(θ)は、

$X(\theta) = 5\cos\theta$

(11)

となる。このとき、θはx軸とのなす角度を示す。水素 原子の強度の投影は、どの角度でも等しくなるので、 信号強度に相当する部分を全て1とおく。その上で、 (10a,10b)式の計測データを、角度を含めた関数として 書き直すと、

 $s'_{re}(k,\theta) = cos(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times 5 \times cos\theta \times k \times 10^{-4})$ (12a)

 $s'_{im}(k,\theta) = -\sin(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times 5 \times \cos\theta \times k \times 10^{-4})$ (12b)

となる。ここでも、kは0から計測数nまでの整数値をと る。実部と虚部の計測データを、kとθを軸として画像 で表したものを図4(a), (b)に示す。横方向は、投影あ たりの計測値の並びであるk軸とし、縦方向は、異な った投影のデータを順番に並べたθ軸としている。こ のデータはFID信号に相当するので、計測データはフ ーリエ変換に必要なデータの半分しかない。ここから 画像を再構成する場合は、残り半分のデータを作る必 要がある。再構成画像が実部しか存在しないことか ら、フーリエ変換領域(計測領域)の実部のデータは、 kが負の場合はそのまま折り返せばよい。また、虚部 のデータは、kが負の場合は折り返してから-1を掛け て正負を逆にする。その処理を施したデータからFBP 法を用いて再構成した結果を図5に示す。

また、勾配磁場Gを0.2G/cm、0.05G/cm、0.02G/cm に変えた場合の実部と虚部の計測データと再構成の 結果をそれぞれ図6(a)から(i)に示す。勾配磁場を小 さくしていくと、計測データがなめらかになり、再構成 像の点の位置が中心に近づいていく。これは、勾配磁 場によって、画像視野の範囲が変わってきていること を示している。勾配磁場を大きくすると、画像視野の 範囲が小さくなっていることが分かる。128×128の画 像視野をはじめに仮定した20cm正方にするためには、 勾配磁場Gを約0.12G/cmにすればよい。その時の実 部と虚部の計測データと再構成の結果をそれぞれ図 7(a)から(c)に示す。

3. 数値ファントムの計測

ここで用いる数値ファントムの形状を図8(a)に、その 画像を図8(b)に示す。画素数は128×128で、1辺は 20cmとする。この数値ファントムは楕円の組み合わせ



図4 計測データを、時間軸kを横軸、角度θを縦軸と して、画像で表したもの。勾配磁場Gは0.1G/cmでサ ンプリング間隔を0.1msとしている。



図5 勾配磁場Gが0.1G/cmのデータ(図4のデータ) からFBP法を用いて再構成した画像

で作られており、構成されている楕円の形状と値は表 1に示したとおりである。数値ファントムの画像の値は、 1番目の楕円から順にそれらの値を加えていったもの になる。

数値ファントムの場合、計測される信号は、画像の 各点から放出された信号の和となる。また、投影再構 成法では、一方向にのみ勾配磁場をかけるので、その 方向に垂直な向きのデータは、同じ周波数を持つ。よ って、その向きのデータは同じ周波数として足し合わ さった形となる。これは、勾配磁場と垂直な方向では、 単純に足し合わせとなり、勾配磁場方向では、場所に よって周波数が異なり、最終的にそれらが重なり合っ 182-(44)



図6 勾配磁場Gを変えた場合の計測データと再構成の結果。



(b) 勾配磁場が0.12G/cmの虚部の

データ



(c) 勾配磁場が0.12G/cmの 再構成像

図7 勾配磁場を0.12G/cmにした場合の計測データと再構成の結果。

表1 数値ファントムの楕円の構成。数値ファントムは これらの楕円を組み合わせで作られている。表の数値 は、画像の中心を原点として、縦軸、横軸共に±1の長 さに規格化されている。

	中心の座標	短軸の長さ	長軸の長さ	回点角度(゜)	楕円の値
1	(0.0,0.0)	0.69	0.92	0.0	2.0
2	(0.0,-0.0184)	0.6624	0.874	0.0	-1.0
3	(0.22,0.0)	0.11	0.31	-18.0	-0.7
4	(-0.22,0.0)	0.16	0.41	18.0	-0.7
(5)	(0.0,0.35)	0.21	0.25	0.0	1.0
6	(0.0,0.1)	0.046	0.046	0.0	0.5
7	(0.0,-0.1)	0.046	0.046	0.0	0.5
8	(-0.08,-0.605)	0.046	0.023	0.0	0.5
9	(0.0,-0.605)	0.023	0.023	0.0	0.5
10	(0.06,-0.605)	0.023	0.046	0.0	0.5
1	(0.56,-0.4)	0.03	0.2	-21.0	0.5



(a) 数値ファントムの楕円の構成図



(b) 数値ファントムを画像表示したもの

図8 数値ファントムの形状。画素数は128×128で、1 辺は20cm。楕円の組み合わせで作られている。 たものが計測されることになる。垂直な方向を足し合わせた強度は勾配磁場方向Xの関数となり、それを S(X)とし、(2)式を書き換えると、

$$s(t) = \int \bar{S}(X) e^{-i\gamma (B_0 + GX)t} dX$$
 (13)

となる。静磁場強度B₀が含まれる項は、積分の外に 出せるので、その影響は計測後に取り除くことができ、 その項を取り除いた式は、

$$s'(t) = \int \tilde{S}(X) e^{-i\gamma GXt} dX$$
(14)

と表される。これを勾配磁場Gが0.1G/cmのときのシミ ュレーションに当てはめて書き直すと、

$$s'_{re}(t) = \sum_{j=-64}^{63} S(j) \cos(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times \frac{20}{128} \times j \times t)$$
(15a)
$$s'_{im}(t) = \sum_{j=-64}^{63} S(j) \sin(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times \frac{20}{128} \times j \times t)$$
128

(15b)

となる。数値ファントムでは、128画素が20cmに相当し ているので、Xは画素長jで表すと20/128×jとなる。 S(j)は、Xの関数を画素長jの配列として書き直してい る。計測を0.1msごとに行うと、

$$s'_{re}(t) = \sum_{j=-64}^{63} S(j) \cos(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times \frac{20}{128} sj \times k \times 10^{-4})$$
(16a)
$$s'_{im}(t) = \sum_{j=-64}^{63} -S(j) \sin(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times \frac{20}{128} sj \times k \times 10^{-4})$$
(16b)

となる。ここで、kは0から計測数nまでの整数値をとる。

この式は、異なった周波数の波がS(j)で決められる 強度を持って足し合わさった形になっている。この足 し合わせの一部をグラフにして、図9に示す。図9では、 Xの位置が異なるデータが、異なる周波数を持った波



図9 異なる位置のデータが、異なる周波数を持って現 れ、それが足し合わさって計測データとなる様子を表 したグラフ。一部のデータのみを示しているが、異な った周波数の波が足し合わさって、計測データとなる 様子を見て取ることができる。

184-(46)

として表され、その足し合わせが計測データとなる様 子を見て取ることができる。

4. 数値ファントムの画像再構成

投影再構成法では、勾配磁場の角度を変えて1周分 計測しなければならないので、信号の強度S(X)と計 測データs(t)は、それぞれ角度 θ の関数になる。よっ て、 θ の関数として書き換えると、(13)式は、

$$s'(t,\theta) = \int \tilde{S}(X,\theta) e^{-i\gamma (B_0 + GX)t} dX$$
(17)

となる。静磁場強度 B_0 の項を取り除いた式s'(t)も θ の 関数になるので、(14)式は、

 $s'(t,\theta) = \int \tilde{S}(X,\theta) e^{-i\gamma GXt} dX$ (18)

となる。よって、最終的なシミュレーションの式は、計 測を0.1msごとに行う場合、

 $s'_{re}(k,\theta) = \sum_{j=-64}^{03} S(j,\theta) \cos(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times \frac{20}{128} \times j \times k \times 10^{-4})$ (19a) $s'_{im}(k,\theta) = \sum_{j=-64}^{63} -S(j,\theta) \sin(2 \times \pi \times 42.58 \times 10^{6} \times 0.1 \times 10^{-4} \times \frac{20}{128} \times j \times k \times 10^{-4})$ (19b)

となる。ここで、kは0から計測数nまでの整数値をと る。この式をkと θ を軸として画像で表したものを図 10(a), (b)に示す。 この計測データは、FID信号に相当しているので、 やはり半分のデータしかない。残り半分のデータを2節 で示したように作る必要がある。半分のデータを付け 加えたデータからFBP法を用いて画像を再構成する。 再構成した結果を図11に示す。

また、勾配磁場Gを0.2G/cm、0.05G/cm、0.02G/cm に変えた場合の実部と虚部の計測データと再構成の 結果をそれぞれ図12(a)から(i)に示す。勾配磁場が 0.2G/cmの場合は、再構成像が視野範囲を超えてい るので、折り返しの影響が出ている。逆に、勾配磁場 を小さくすると、視野範囲が広がり、再構成像は小さ くなる。よって、勾配磁場が大きい方が、再構成像の より細かい部分を拡大して再構成できることが分かる。 視野範囲を仮定した20cm正方になるように、勾配磁場 を0.12G/cmとして計測し、再構成した結果を図13(a) から(c)に示す。

MRI計測の場合、サンプリング間隔が一定の場合、 勾配磁場の強度によって再構成される画像の視野範 囲が異なる。勾配磁場を大きくすると、視野範囲が狭 まるが再構成される画像は大きくなり、より細かいとこ ろも再構成できるようになる。ただし、勾配磁場をより 大きくした場合、再構成画像に折り返しが起こらない ようにサンプリング間隔をより小さくする必要がある。





(b) 虚部の計測データ

図10 数値ファントムから作成した計測データを、時 間軸kを横軸、角度 θ を縦軸として、画像で表したもの。 勾配磁場Gは0.1G/cmでサンプリング間隔を0.1msとし ている。



図11 勾配磁場Gが0.1G/cmの数値ファントムの計測 データ(図10のデータ)からFBP法を用いて再構成し た画像。

2001年9月30日





(a) 勾配磁場が0.2G/cmの実部の データ



(d) 勾配磁場が0.05G/cmの実部の データ



(b) 勾配磁場が0.2G/cmの虚部の データ



(e) 勾配磁場が0.05G/cmの虚部の データ



(c) 勾配磁場が0.2G/cmの 再構成像



(f) 勾配磁場が0.05G/cmの 再構成像



(g) 勾配磁場が0.02G/cmの実部の データ



(h) 勾配磁場が0.02G/cmの虚部の データ



(i) 勾配磁場が0.02G/cmの 再構成像

図12 勾配磁場Gを変えた場合の数値ファントムの計測データと再構成の結果。



(a) 勾配磁場が0.12G/cmの実部の データ



(b) 勾配磁場が0.12G/cmの虚部の データ



(c) 勾配磁場が0.12G/cmの 再構成像

図13 勾配磁場を0.12G/cmにした場合の数値ファントムの計測データと再構成の結果。

ダウンロードされた論文は私的利用のみが許諾されています。公衆への再配布については下記をご覧下さい。

複写をご希望の方へ

断層映像研究会は、本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託してお ります。

本誌に掲載された著作物の複写をご希望の方は、(社)学術著作権協会より許諾を受けて下さい。但 し、企業等法人による社内利用目的の複写については、当該企業等法人が社団法人日本複写権センタ ー((社)学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を再委託している団体)と包括複写許諾 契約を締結している場合にあっては、その必要はございません(社外頒布目的の複写については、許 諾が必要です)。

権利委託先 一般社団法人学術著作権協会

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-6-41 乃木坂ビル 3F FAX:03-3475-5619 E-mail:info@jaacc.jp

複写以外の許諾(著作物の引用、転載、翻訳等)に関しては、(社)学術著作権協会に委託致しておりません。

直接、断層映像研究会へお問い合わせください

Reprographic Reproduction outside Japan

One of the following procedures is required to copy this work.

1. If you apply for license for copying in a country or region in which JAACC has concluded a bilateral agreement with an RRO (Reproduction Rights Organisation), please apply for the license to the RRO.

Please visit the following URL for the countries and regions in which JAACC has concluded bilateral agreements.

http://www.jaacc.org/

2. If you apply for license for copying in a country or region in which JAACC has no bilateral agreement, please apply for the license to JAACC.

For the license for citation, reprint, and/or translation, etc., please contact the right holder directly.

JAACC (Japan Academic Association for Copyright Clearance) is an official member RRO of the IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) .

Japan Academic Association for Copyright Clearance (JAACC)

Address 9-6-41 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

E-mail info@jaacc.jp Fax: +81-33475-5619